

TEMARIO E-LEARNING SINCRÓNICO

TÉCNICAS DE MUESTREO BAJO LA NORMA CHILENA 44

- CÓDIGO SENCE: 1238074141
- CÓDIGO INTERNO: IF-SI021-ES



OBJETIVOS DEL CURSO:

- Al finalizar el curso, el participante será capaz de identificar conceptos teóricos necesarios para aplicar la técnica de muestreo por atributos, de acuerdo a la Norma Chilena 44 y a los principios de buenas prácticas de manufactura.

I MÓDULO “INTRODUCCIÓN”.

1. Nociones básicas de estadística.
2. Referencias normativas.
3. Terminología, definiciones y símbolos.

II MÓDULO “NO CONFORMIDADES”.

1. Clasificación de no conformidades.
2. Tratamiento de no conformidades.

III MÓDULO “NIVEL LÍMITE DE CALIDAD ACEPTABLE (AQL)”.

1. Uso y aplicación.
2. Especificaciones del aql.

IV MÓDULO “PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO PARA MUESTREO Y ACEPTACIÓN”.

1. Formación de lotes.
2. Presentación de lotes.
3. Aceptabilidad de los lotes.
4. Disposición de lotes.
5. Ítemes no conformes.
6. Clase críticas de no conformidades.

V MÓDULO “EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y CLASES DE INSPECCIONES”.

1. Selección de muestra.
2. Extracción de muestras.
3. Niveles de inspecciones.

VI MÓDULO “PLANES DE MUESTREO”.

1. Obtención de plan de muestreo.
2. Tipos de planes de muestreo.
3. Tablas con planes de muestreo según tipo de inspección.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

- La metodología de enseñanza combina la realización de clases expositivas On-line, análisis de casos y talleres de discusión de problemas.
- Retroalimentación a través de preguntas y respuestas entre el relator y los participantes.

DURACIÓN

- 08 Horas Cronológicas.
- 11 Horas Pedagógicas.